Полностью оборудованная для сканирования с произвольным доступом к разным областям образца, эта конфигурация включает в себя как сканер с 1 резонансным и 2 гальваническими зеркалами (1 путь), так и сканер с 2 гальваническим зеркалами (2 путь). Система использует лазер с двумя выходами для мультифотонной визуализации.

Спецификация конфигурации	
Основные параметры	
Поле обзора	Квадрат с диагональю 20 мм (макс.) в плоскости формирования промежуточного изображения
Скорость визуализации	Сканер: 2 гальванических и 1 резонансное зеркало (RGG): 8 кГц: 30 к/с при 512 x 512 пикселей или 12 кГц: 45 к/с при 512 x 512 пикселей Гальванический сканер: 3 к/с при 512 x 512 пикселей
Разрешение сканирования	Двунаправленное сканирование: 8 кГц: до 2048 x 2048 пикселей 12 кГц RGG сканер: до 1168 x 1168 пикселей Однонаправленное сканирование: 8 кГц: до 4096 x 4096 пикселей 12 кГц RGG: до 2336 x 2336 пикселей
Фотоактивация	Заданные области: ИК - одновременно, видимый диапазон - последовательно Все поле: В течение обратного хода сканера
Компоненты микроскопа	
Корпус микроскопа	Смещение по осям
1 оптический путь	Сканер: 2 гальванических и 1 резонансное зеркало (8 или 12 кГц)
2 оптический путь	Гальванический сканер (Ø4 мм или Ø5 мм)
Рабочий диапазон	1 путь: 680 - 1600 нм 2 путь: 450 - 1100 нм
Ячейка Поккельса	250 кГц - 1 путь
Регулируемый аттенюатор	Моторизированный
Мультифотонное детектирование	2 GaAsP ФЭУ (с охлаждением) 2 GaAsP ФЭУ (без охлаждения)
Модуль с собирающей оптикой	14° с затвором
Держатель объектива	1
Объектив	Nikon 25X (с пьезосканером)
Платформа для образца	Платформа Gibraltar
Широкопольная визуализация	Модуль освещения проходящим светом + модуль для контрастной визуализации (метод Dodt) Модуль освещения отраженным светом с револьвером для 6 наборов фильтров Четырехканальный светодиодный источник, сопряженный с оптоволокном Quantalux™ sCMOS научная камера
Лазер	Spectra Physics InSight перестраиваемый Лазер